文章编号:1001-9014(2023)05-0574-07

DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.002

长/长波双色二类超晶格红外探测器研究

刘 铭1*, 游聪娅1, 李景峰1, 常发冉2, 温 涛1, 李 农2, 周 朋1, 程 雨1,

王国伟2*

(1. 华北光电技术研究所,北京 100015;

2. 中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室,北京100083)

摘要:报道了长/长波双色二类超晶格红外焦平面探测器组件的研制。通过能带结构设计和分子束外延技术,获得 了表面质量良好的长/长波双色超晶格外延材料。突破了长波超晶格低暗电流钝化、低损伤干法刻蚀等关键技术, 制备出像元中心距 30 μm 的 320×256 长/长波双色 InAs/GaSb 超晶格焦平面探测器芯片。将芯片与双色读出电路互 连,采用杜瓦封装,与制冷机耦合形成探测器组件。组件双波段50%后截止波长分别为7.7μm(波段1)和10.0μm (波段2)。波段1平均峰值探测率达到8.21×10¹⁰ cm·W⁻¹·Hz¹², NETD 实现28.8 mK; 波段2平均峰值探测率达到 6.15×10¹⁰ cm·W⁻¹·Hz^{1/2}, NETD 为 37.8 mK, 获得了清晰的成像效果, 实现长/长波双色探测。 关键 词:二类超晶格;长/长波;双色;焦平面阵列

中图分类号:TN214 文献标识码: A

Research on InAs/GaSb type-II superlattice dual-band long-/longwavelength infrared photodetector

LIU Ming^{1*}, YOU Cong-Ya¹, LI Jing-Feng¹, CHANG Fa-Ran², WEN Tao¹, LI Nong², ZHOU Peng¹, CHENG Yu¹, WANG Guo-Wei^{2*}

(1. North China Research Institute of Electro-optics, Beijing 100015, China;

2. The State Key Laboratory of Superlattices and Microstructures, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Science, Beijing 100083, China)

Abstract: The development of type II superlattice dual-band long-/long-wavelength infrared focal plane photodetector is reported. Through the design of energy band structure and molecular beam epitaxial technology, dual-band long-/longwavelength superlattice epitaxial material with good surface quality has been obtained. The 320×256 dual-band long-/ long-wavelength InAs/GaSb superlattice focal plane photodetector with pixel center distance of 30 µm was prepared by breaking through the key technologies of low dark current passivation and low damage dry etching. The detector chip is interconnected with a dual color readout circuit, packaged in a Dewar package, and coupled to a refrigerator to form a detector assembly. The dual-band 50% cut-off wavelengths of the photodetector are 7.7 µm (band 1) and 10.0 µm (band 2), respectively. The average peak detectivity of band 1 reached 8. 21×10^{10} cm \cdot W¹ \cdot Hz^{1/2}, and NETD achieved 28.8 mK. The average peak detectivity of band 2 reached 6. 15×10¹⁰ cm·W⁻¹·Hz^{1/2}, and the NETD was 37.8 mK. Clear imaging of both colors has been achieved, demonstrating the realization of long-/long-wavelength dual-band photodetection.

Key words: type-II superlattice, long-/long-wavelength, dual-band, focal plane array

收稿日期:2023-03-22,修回日期:2023-06-13

Received date: 2023-03-22, Revised date: 2023-06-13

基金项目:装备研制项目

Foundation item: Supported by the Equipment Model Development Project.

作者简介(Biography):刘铭(1985-),男,江西吉安人,研究员,主要研究领域为红外探测材料与器件。E-mail:kaka_851001@163.com *通讯作者(Corresponding authors): E-mail:kaka_851001@163. com;wangguowei@semi. ac. cn

引言

双色红外探测器可以同时获取目标和环境在 两个波段的辐射特征,从而有效抑制复杂的背景噪 声,实现不受环境制约的红外探测,提升目标的探 测效果,在预警、搜索和跟踪系统中能明显地降低 虚警率,显著地提高系统性能^[1]。目前双色红外探 测器的研究主要包括短/中波、中/中波、中/长波和 长/长波等^[2-6]。

近年来长/长波双色红外探测器应用研究上取 得了较大的发展,采用的材料主要为二类超晶格与 碲镉汞。2011年,美国西北大学报道了第一个320× 256 InAs/GaSb II类超晶格长/长波双色探测器,截止 波长分别为9.5 µm和13 µm,噪声等效温差在两个 波段均为约20mK。进一步扩大面阵规格^[7],2012 年美国西北大学报道了面阵规格为640×512的长/ 长双色焦平面探测器,像元间距为30 µm,在81K下 测得蓝色和红色通道的 NETD 分别为 15 mK 和 20 mK^[8]。美国Raytheon公司的长/长波碲镉汞红外探 测器阵列规模达到512×512,截止波长分别为7.0~ 8.5 µm以及10.0~11.5 µm,其70 K下暗电流密度 与液相外延单色长波碲镉汞探测器相当(10⁻⁶ A/cm² 量级)^[9]。2019年,中国科学院半导体研究所报道了 nipin型叠层长/长波双色单元红外探测器^[10]。当前 国内尚无超晶格长/长双色红外焦平面探测器的相 关报道和应用。

与碲镉汞相比,锑基II类超晶格具有暗电流低、 工艺稳定性高、材料缺陷少等优点,尤其是在长波 和甚长波波段的应用,超晶格展现出了更大的优 势^[11-14]。本文开展了InAs/GaSb II类超晶格长/长波 双色红外焦平面探测器结构设计、材料生长、探测 器制备等研究,制备了像元中心距 30 μm 的 320× 256 长/长波双色超晶格红外探测器组件,通过偏压 对工作波段进行选择。双波段后截止波长分别为 7.7 μm(波段1)和10.0 μm(波段2)。波段1平均峰 值探测率达到 8.21×10¹⁰ cmW⁻¹Hz^{1/2}, NETD 实现 28.8 mK;波段 2 平均峰值探测率达到 6.15×10¹⁰ cmW⁻¹Hz^{1/2}, NETD 为 37.8 mK,并耦合光学系统实现 了成像演示。

1 实验

1.1 器件结构设计

为抑制器件的暗电流和双波段间的光谱串音, 本 文 基 于 NM π P-P π MN 结构,在两通道间插入 Al_{0.2}Ga_{0.8}Sb势全阻挡电子反向移动,移除两个p型接 触区,组成"NM π B π MN"器件结构,通过改变势全区 的掺杂浓度调整两个通道的饱和偏压和光谱串音, 器件结构及能带如图1所示。

1.2 材料生长与质量表征

文中使用材料采用分子束外延技术进行制备, 针对长/长波双色超晶格材料生长温度窗口窄、中间 势垒区与超晶格区生长温度相差大(约75℃)、长波 吸收区 InSb 层厚度大使应力大的问题,本文通过调 节材料的 V 族 III 族束流比、衬底温度、III 族元素的 源炉温度、快门开关顺序来保证材料符合器件制备 标准。通过能带模拟,设计出短长波和长长波吸收 区分别为 10.5 ML InAs/7 ML GaSb 和 14 ML InAs/7 ML GaSb。根据已有经验,长波超晶格吸收区需要 更多的 InSb 平衡应力,太多的 InSb 界面导致外延难



图1 长/长波双色器件结构及能带图

Fig. 1 Schematic of long-/long-wavelength dual-band photodetector architecture and corresponding energy band structure

度增大。在GaSb衬底上要实现共格生长,1 ML的 InAs需要0.1 ML的InSb平衡张应力,因此短长波吸 收区和长长波吸收区各需要1.05 ML和1.4 ML的 InSb平衡应力。考虑到界面处存在的部分GaAs,实 际需要的InSb厚度要更多,太多的InSb可能会导致 应力释放,破坏晶格结构。10.5 ML InAs/7 ML GaSb 需要1.05 ML InSb平衡应力,在InAs on GaSb界面 处更容易形成InSb界面。因此在InAs on GaSb界面 处生长0.52 ML InSb,在GaSb on InAs界面处生长 0.53 ML InSb。14 ML InAs/7 ML GaSb需要1.4 ML InSb平衡应力,如果采用InSb 双界面,两边的InSb 厚度为0.7mL,这个数值接近晶格弛豫的临界值,因 此采用三界面生长方式,在InAs on GaSb界面和 GaSb on InAs界面处各生长0.45 ML InSb,并在 GaSb层中间位置插入0.5 ML InSb。界面生长顺序如图2所示。

为了表征材料质量,将外延的长/长波双色超晶 格材料进行光学显微镜、原子力显微镜(AFM)、X射 线衍射仪测试(XRD),表征材料表面形貌和晶格完 整性。在外延样品选取多个点位进行测试。对表 面缺陷数量进行统计,视场长度和宽度分别为344 μm和245μm,视场面积为0.08428 cm²。材料表面 缺陷密度小于120 cm⁻²。

图4为超晶格双色材料的AFM测试图像,扫描 范围为10 μm×10 μm,结果显示材料表面粗糙度*Ra* 均小于0.2 nm,表面起伏较小,证明了超晶格具有 良好的表面质量。

图5为材料X射线衍射仪的测试图谱,材料有



图2 (a)10.5 ML InAs/7 ML GaSb界面生长顺序,(b)14 ML InAs/7 ML GaSb界面生长顺序

Fig. 2 (a) Growth sequence of 10. 5 ML InAs/ 7 ML GaSb interface, (b) growth sequence of 14 ML InAs/ 7 ML GaSb interface



图3 长/长波双色超晶格材料表面形貌(a)样品#1,(b)样品#2

Fig. 3 Surface morphology of long-/long-wavelength dual-band superlattice materials (a) sample #1 and (b) sample #2



图4 长/长波双色超晶格材料AFM测试图像(a)样品#1,(b)样品#2

Fig. 4 AFM image of long-/long-wavelength dual-band superlattice materials (a) sample #1 and (b) sample #2

多级卫星峰,不同点位卫星峰的位置高度重合,吸收区一级卫星峰半峰宽均小于30 arcsec,应力均在200 arcsec以内,表明超晶格材料具有良好的生长周期和晶格质量。

根据材料设计,短长波吸收区设计厚度为56.5395Å;长长波吸收区的设计厚度为68.2741Å; M层(18 ML InAs /3 ML GaSb/5 ML AlSb/3 ML GaSb) 的设计厚度为92.0481Å。

设计吻合度的计算方法为周期厚度/设计厚度, 得到 M 层、长长波、短长波的设计吻合度分别为 99.29%、99.44%和97.37%。数据拟合结果和详细 卫星峰参数如表1所示。

通过以上对外延的长/长波双色超晶格材料的 表面形貌、粗糙度和XRD表征,结果均验证了所生 长的超晶格材料具备较好的晶体质量,可以满足制 备焦平面阵列的需求。

1.3 器件制备与性能测试

本文制备的焦平面探测器芯片阵列规格为 320×256,像元中心距为30 µm×30 µm。芯片的制 备工艺流程包括:通过光刻和ICP干法刻蚀形成台 面结结构,使像素间产生隔离。采用PECVD等离 子体化学气相沉积在台面结构的表侧壁覆盖 SiO_xN_y/SiO₂钝化层。经过刻蚀工艺开出电极接触通 孔,通过光刻与电子束蒸发制备Ti/Pt/Au 金属电 极。将制备得的芯片与专用双色读出电路通过钢 柱倒装互连,形成混成芯片。再通过低应力底部填 充与背减薄技术,减薄衬底,完成长/长波双色超晶 格红外探测器芯片的制备,芯片实物和焦平面像元 阵列如图6所示。

将完成上述工艺的 320×256(30 µm)长/长波 双色超晶格红外探测器芯片进行微杜瓦封装,冷屏 F数为2,制冷至约70 K。将20 ℃黑体和35 ℃黑体 先后对准测试窗口,通过焦平面测试系统采集全面 阵各像元的响应信号。设置积分时间和调节偏置, 计算出探测器的性能参数,包括探测率、盲元率、响 应非均匀性等。

2 结果及分析

2.1 电学特性

采用低温探针台系统(Agilent B1500A)对 InAs/GaSb超晶格长/长波双色探测器芯片的电学 特性进行测试。光敏元面积为 30 μm×30 μm,测 试温度为 77 K。测试得随偏压变化的长/长波双 色器件电流密度-电压(J-V)曲线,并通过计算得 出阻抗面积乘积-电压(RA-V)曲线如图 7 所示。 从该图可以看出,偏压为-150 mV时,短长波二极 管暗电流密度为 8. 2×10⁻⁴ A/cm²,差分电阻和面积 乘积 RA 值为 7. 4×10⁴ Ωcm²。偏压为 50 mV时,长 长波二极管暗电流密度为 1. 2×10⁻³ A/cm², RA 值为 70. 3 Ωcm²。



图5 长/长波双色超晶格材料 XRD 测试图谱

Fig. 5 XRD image of long-/long-wavelength dual-band superlattice

表1 长长波材料的 XRD 峰位、周期厚度及设计吻合度

Table 1 The XRD peaks, periodic thicknesses and design match of superlattice

峰位	-2级峰	-1级峰	1级峰	2级峰	平均值	周期厚度	设计厚度	吻合度
M结构	-4020	-2025	2005	4035	2015	91.3902	92.0481	0. 9929
长长波	-5375	-2690	2735	5485	2712.5	67.8899	68.2741	0.9944
短长波	-6795	-3500	3190	6585	3345	55.0527	56. 5395	0.9737



图6 (a)320×256(30 μm)长/长波双色超晶格探测器混成芯片照片,(b)焦平面像元阵列 SEM 照片 Fig. 6 (a)Microscopic image of 320×256 (30 μm) long-/long-wavelength dual-band superlattice photodetector, and (b) scanning electron micrograph of focal pixel array.



图 7 J-V和RA-V特性曲线 Fig. 7 Characterization of J-V and RA-V curves

2.2 光谱响应

在 70 K下通过傅里叶红外光谱仪(VERTEX 70)与高温黑体测试探测器的光谱响应特性。本文 像元器件结构为两个背靠背的 PN结,通过调节整 体工作偏压,实现双波段的探测。偏压调节下焦平 面器件的长波相对双色响应光谱如图 8 所示,其中 波段 1 的 50% 后截止波长约为 7.7 μm,波段 2 的后 截止波长约为 10.0 μm,体现了组件的长/长波双色 红外探测功能。根据相对光谱串音的定义,计算得 出短长波向长长波的串音为 11.8%,长长波向短长 波的串音为 35.0%。长长波在短长波波段存在较 大相对光谱串音,主要来源于较薄的短长波吸收 层,未被吸收的光子辐射至长长波吸收层,被吸收 后产生光谱串音。后续应进一步增加短长波波段 的吸收区厚度,或在双色通道间引入反射光栅,减 少辐射至长长波通道的短长波光子数量。



图 8 长/长波双色超晶格探测器光谱响应曲线 Fig. 8 Spectral response of superlattice dual-band long-/longwavelength infrared photodetector

2.3 成像演示

将焦平面器件封装入微杜瓦,形成制冷型红外 探测器组件。长/长波超晶格焦平面探测器组件的双 波段成像效果如图9所示。从图中可清晰的分辨出 人脸、口罩、帽檐等图像特征,成像效果清晰。组件 通过双色读出电路实现信号提取,双波段图像信号 反向。组件测试结果为短长波的平均峰值探测率达 到8.21×10¹⁰ cm·W⁻¹·Hz¹¹², NETD 实现 28.8 mK, 盲元 率为4.17%;长长波的平均峰值探测率达到6.15× 10¹⁰ cm·W⁻¹·Hz¹¹², NETD 为 37.8 mK, 盲元 率 为 4.95%;证明了器件具有双波段探测信息分辨能力。

3 结论

本文报道了基于双色叠层超晶格材料的长/长 波双色焦平面探测器。通过分子束外延技术成功



图 9 双波段成像演示图(a)波段1成像图,(b)波段2成像图 Fig.9 Infrared imagings of dual-band FPA (a) Band-1 channel imaging (b)Band-2 channel imaging

制备了NPN叠层结构的双色超晶格材料,并由材料 表征验证了超晶格晶体质量。采用光刻、ICP干法 刻蚀、PECVD钝化等工艺,实现了320×256规格、30 μm像元中心距的长/长波双色超晶格焦平面探测器 芯片制备。通过与长/长波双色读出电路倒装互连、 杜瓦封装、耦合分体式制冷机后,形成长/长波双色 超晶格红外焦平面组件。在70 K下,通过响应光谱 测试,验证了探测器的长/长波双色探测功能。组件 性能测试得到,该双色超晶格焦平面探测器的双波 段截止波长分别为7.7μm和10.0μm,NETD分别 为28.8mK和37.8mK,并实现了清晰的成像演示, 为后续长/长波双色超晶格焦平面探测器迈向工程 化奠定了基础。

References

- [1] YANN R, FABIEN C, CEDRIC V, et al. Infrared Dual Banddetectors for next generation [C]//Proc. of SPIE, 2011, 8012: 801238.
- [2] REHM R, WALTHER M, RUTZ F, et al. Dual-color InAs/ GaSb superlattice focal-plane array technology [J]. J. Electron. Mater., 2011, 40(8): 1738–1743.
- [3] REHM R, WALTHER M, SCHMITZ J, et al. Dual-colour thermal imaging with InAs/GaSb superlattices in mid-wavelength infrared spectral range[J]. Electron. Lett., 2006, 42 (10): 577–578.
- [4] EDWARD S, LE P, GREGORY V, et al. Two-Color HgCdTe Infrared Staring Focal Plane Arrays [C]// Proc. of SPIE, 2003, 5209: 160485.
- [5] BAI Zhi-Zhong, XU Zhi-Cheng, ZHOU Yi, et al. 320× 256 dual -color mid-wavelength infrared InAs/GaSb superlattice focal plane arrays[J]. J. Infrared Millim. Waves (白

治中,徐志成,周易,等.320×256元InAs/GaSb II 类超晶 格中波红外双色焦平面探测器.红外与毫米波学报), 2015,**34**(6):716-720.

- [6] HOANG A M, CHEN G, HADDADI A, et al. Demonstration of high performance bias -selectable dual-band short-/ midwavelength infrared photodetectors based on type-II InAs/GaSb/AlSb superlattices [J]. Appl. Phys. Lett., 2013, 102: 011108.
- [7] EDWARD K H, ABBAS H, CHEN Guan-Xi, et al. Type-II superlattice dual-band LWIR imager with M-barrier and Fabry - Perot resonance [J]. Opt. Lett., 2011, 36 (13): 2560-2562.
- [8] EDWARD K H, MANIJEH R. World's first demonstration of type-II superlattice dual band 640x512 LWIR focal plane array[C]// Proc. of SPIE, 2012, 8268: 8268Z.
- [9] SMITH E P G, VENZOR G M, GALLAGHER A M, et al. Large format HgCdTe focal plane arrays for dual-band long-wavelength infrared detection [J]. J. Electron. Mater., 2011. 40(8): 1630-1636.
- [10] JIANG Zhi, SUN Yao-Yao, GUO Chun-Yan, et al. High quantum efficiency long-/long-wave dual-color type-II InAs/GaSb infrared detector [J]. Chinese Phys. B, 2019, 28(3): 038504.
- [11] DOMINIC K, MANOJ K, EZEKIEL A, et al. Recent trends in 8–14 µm type–II superlattice infrared detectors [J]. Infrared Phys. Tech., 2021, 116: 103756.
- [12] KOPYTKO M., ROGALSKI A. Performance Evaluation of Type-II Superlattice Devices Relative to HgCdTe Photodiodes [J]. *IEEE Trans. Electron Devices*, 2022, 69 (6): 2992–3002.
- [13] RHIGER D R. Performance Comparison of Long-Wavelength Infrared Type II Superlattice Devices with HgCdTe
 [J]. J. Electron. Mater., 2011, 40(8): 1815–1822.
- [14] HÖGLUND L, RODRIGUEZ J B, NAUREEN S, et al. Very long wavelength type-II InAs/GaSb superlattice infrared detectors[C]//Proc. of SPIE, 2018, 10624.

《红外与毫米波学报》征稿简则

一、征稿范围

580

《红外与毫米波学报》是经国家新闻出版署批准,由中国科学院主管,中国科学院上海技术物理研究所和中国光学学会主 办,科学出版社出版,国内外公开发行的学术刊物。其宗旨是发扬学术民主、活跃学术思想、促进国内外同行间的学术交流、促 进红外与毫米波科学技术的不断发展。其特色是反映红外与毫米波领域的最新研究成果和技术进展。本刊原名《红外研究》, 于1982年创刊,根据学科发展和国际学术交流的需要,从1991年更名为《红外与毫米波学报》,使本刊学科覆盖范围从红外扩 展到毫米波波段,填补了我国毫米波领域学术期刊的空白。本刊被《SCI》(美国科学引文索引)、《EI》(美国工程索引)、《CA》 (美国化学文摘)、《SA/INSPEC》(英国科学文摘)、《JICST》(日本科学技术文献速报)、《AJ》(俄罗斯文摘杂志)、《SCOPUS》(SCO-PUS网络数据库)、《METADEX》(METADEX光盘数据库)等国际著名检索体系收录。

红外与毫米波科学技术领域是信息科学和物理学的交叉学科,是当前信息技术的重要前沿领域,其水平的高低反映了一 个国家的科技、军事核心竞争力。《红外与毫米波学报》主要报道红外毫米波与太赫兹领域的新概念、新成果、新进展,刊登在红 外物理、太赫兹科学与技术、遥感与空间探索以及凝聚态光学性质、低能激发过程(包括低维系统和电子结构计)、飞秒光谱学、 非线性光学、红外光电子学、毫米波技术(包括元器件、系统及应用、智能信息技术和人工神经网络、生物医学光学研究)等方面 有创新的研究论文、研究简报,具有国际、国内先进水平的学术论文以及高水平的述评,具有数据详实、结果可信且有实用意义 的实验报告,具有国内外先进水平的应用技术文章、阶段性科研成果的研究简报、快报等。英文研究论文不受出版周期限制, 录用后将优先发表。

二、投稿要求

1. 网上投稿:http://journal.sitp.ac.cn/hwyhmb/,投稿时请上传word格式稿件。

2. 推荐审稿专家(与作者不在同一单位和地域)1-3位,需要提供他们的主要研究方向、单位、通讯地址和Email。

3. 首页页脚请标注第一作者、通讯作者(包括出生年、职称、学位、主要研究方向和Email)。

三、文字与篇幅

1. 要求主题突出、立意新颖、论点正确、论据充分、数据真实可靠、文字精练、条理清晰、语言流畅。论文着重阐明作者自 己的创新内容。

2. 摘要:采用第三人称叙述,写成报道性文摘。内容包括研究目的、方法、结果及结论等。中英文摘要字数均应在500字 左右。

3. 关键词:每篇文章至少给出5个关键词。中英文对应,分别列在中英文摘要之后。

4. 中图分类号:按《中国图书馆图书分类法》(第6版)确定,列在中文关键词之后。

四、插图和表格

1. 插图:文中图形力求少而精,排于正文中相应位置。注明图题(图题为中英文对照)和图注(英文)。

2. 表格:文字表格使用三线表(不用竖线),可加辅助线。放在文中适当的位置,表格与图形、正文内容不能重复。

五、参考文献

参考文献在正文中所引用之处以上脚带方括号的形式标出(大、小标题中不能有文献著录)。参考文献一般不少于15条。 列人的参考文献必须是作者亲自阅读过,并在论文中直接引用的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。引用的网上出版物 必须是固定的、可一直查阅的文献。本刊提倡作者在自己的文章中对国内外同行已发表的相关论文予以充分反映。

六、录用及退稿

1. 录用:初审通过的稿件自送审之日起1-3个月基本会有最终意见。

被录用稿件,遵照中国科协和中国科学院有关文件精神,将收取相应版面费。文章刊出后,为每篇文章第一作者提供样刊 2本,并酌付稿酬。

七、特别声明

1. 我们会采用学术不端软件进行检测,务必做到诚信规范,切勿一稿多投、抄袭等,否则责任自负。如果发现以上行为, 本刊将在同专业期刊之间通报,追究对本刊造成的损失,两年内不再接受该作者的文章。

2. 论文的保密审查由作者所在单位进行,编辑部概不负责,必要时作者应请所在单位出具可公开发表的证明。

3. 版权转让协议需所有作者签名,本刊刊出后,作者之版权(含各种介质、媒体的版权)转让给《红外与毫米波学报》编辑 部,但作者仍保有合理使用、学习、研究或教学中使用作品的权利。

> 《红外与毫米波学报》编辑委员会 2023-09-01